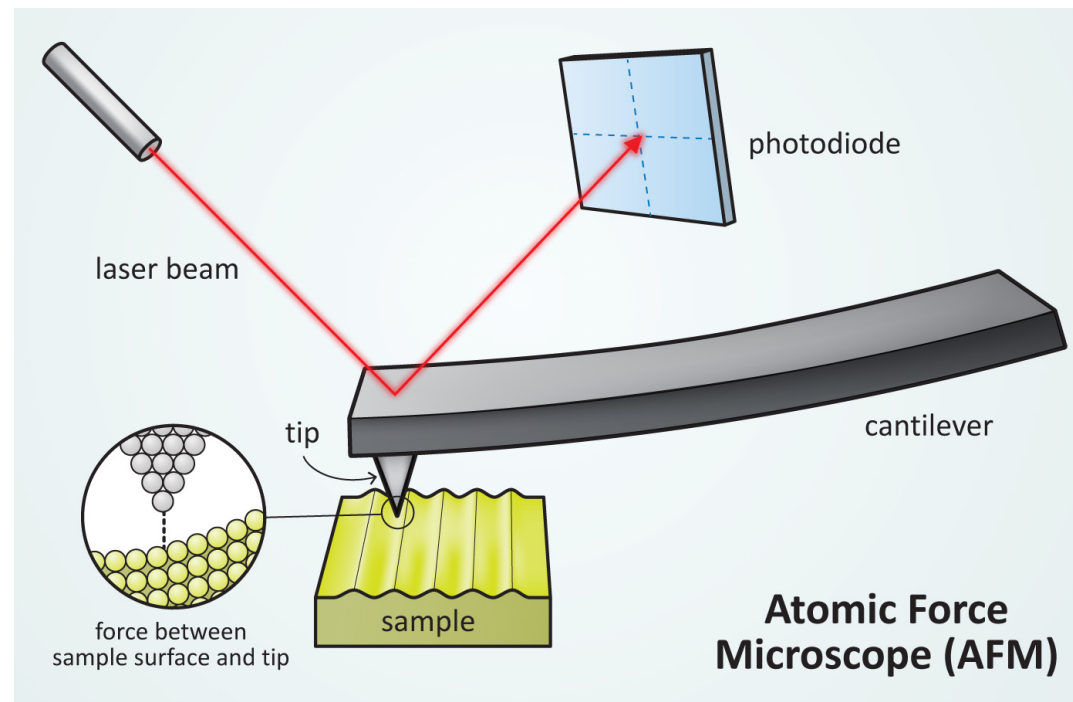




Los microscopios de fuerza atómica

Los microscopios de fuerza atómica, o AFM (por sus siglas en inglés), son un tipo de microscopio de sonda de barrido. Los AFM tienen una punta de sondeo montada al final de una palanca. Cuando la punta está cerca de la superficie de la muestra, una fuerza mueve la palanca. Los AFM pueden detectar muchos tipos de fuerzas, incluidos el contacto físico, fuerzas electroestáticas y magnéticas. El movimiento es medido por un láser que es reflejado desde el borde de la palanca hacia un grupo de fotodiodos. Los AFM pueden detectar movimientos diminutos, ¡tan pequeños como una fracción de nanómetro!



Para analizar una muestra, la punta del AFM es movida muchas veces hacia delante y hacia atrás. Un programa de computadora combina estos datos y crea una imagen.